

# NFC RFテストベンチ ソリューション

NFC製品の事前検証で、  
より迅速に市場投入へ

## 最新仕様による非接触ソリューションの 承認を

Fime は現在の業界規格に沿った革新的な決済およびスマートモビリティ製品の開発を可能にする非接触アナログおよびデジタルテストベンチを提供します。

これらのソリューションは、大手電子機器メーカーであるNI(ナショナルインスツルメンツ社)と、ソフトウェアおよびテストスイートの開発企業であり認定テストツールのリーディングインテグレーターでもあるFimeとの長期的なパートナーシップから生まれました。

Fimeの認定ラボでは、正式な承認試験を実施するためにこのテストベンチを毎日使用しており、当社とのエキスパートがお客様と協力し、これらのテストベンチソリューションを通じて製品設計の信頼性を高めます。テストベンチソリューションは、お客様の製品設計を加速させ、その信頼性を高めます。

## 構成

アナログとデジタルのテストベンチは、信号を生成・記録するNI社のハードウェアと、解析・判定を行うFime社のソフトウェアで構成されています。必要に応じて、測定位置にDUTを移動させるロボットも提供可能です。

Fimeは、プロジェクトのライフサイクルのどの段階においても、お客様をサポートします。

定義

設計

納品

テスト



Fimeラボ  
使用

非接触アナログ&  
デジタルテスト

## 主なメリット

- 非接触試験におけるマーケットリーダーである2社が開発した最も技術的に進んだ認定ツールを使用して、革新的な製品を準備することができます。
- 多くのNFCフォーラムとEMVCoの認定ラボで使用されているのと同じツールを使用して、製品の認証準備を加速させます。
- NIの新しいエミュレータCTS IIIにより、テスト時間を75%以上短縮\*できます。

\*NI社の前機種(CTS II)との比較

## 主な特徴

- EMVCoとNFCフォーラムの認証テストベンチです。
- 簡単で便利なMPManagerプラットフォームで、テストベンチシリーズの全機能にアクセスできます。
- Fimeは、より早く結果を出すために、ツールのインストールと使用に関するサポートを提供します。

## ライブラリー

認証 テストスイート	CTS III	CTS II MP500 TCL3
EMV 非接触 PICC アナログ v3.0b	✓*	✓
EMV 非接触PICC デジタル v3.2a	✓	✓
EMV 非接触モバイル パフォーマンス v3.0	近日リリース	✓
EMV 非接触 PCD アナログ v3.1a (&COTS)	✓	✓
EMV 非接触 PCD デジタル v3.1a	✓	✓
NFC Forum アナログ CR13	✓	✓
NFC Forum デジタル CR13	✓	✓
NFC Forum LLCP/SNEP CR13	✓	✓
NFC Forum タグパフォーマンス CR13	✓*	✓
NFC Forum タグアプリケーション CR13	✓	✓

✓\* Qualification issued by Q1 2024.



## お問い合わせ

Fimeがどのように貴社のお役に立つか詳しくは以下までご連絡ください

[fime.com](http://fime.com)

[salesjapan@fime.com](mailto:salesjapan@fime.com)

F-T-ADTBS-AD  
非接触アナログ&デジタルテスト

© Fime 2024